薄膜材料の極点図測定とODF解析

2014年12月12日

HelperTex Office

山田 義行 odftex@ybb.ne.jp

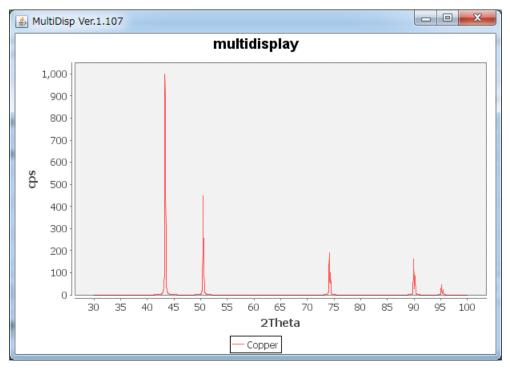
不明な点はご質問下さい。データ解析も行います。

概要

近年、薄膜材料の方位測定として、極点が利用されているが、極点測定の信頼性に関して 議論されていない為、本資料を作成してみました。

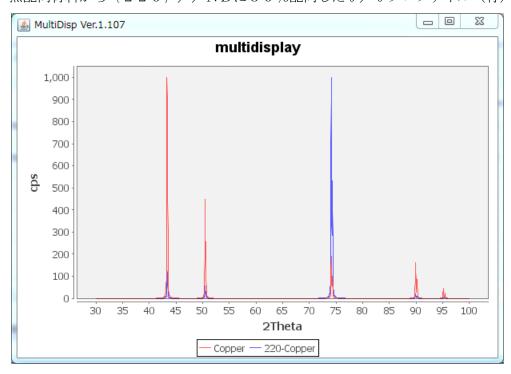
ほとんどの薄膜材料では、繊維配向(//ND-Fiber)になる事が多く、以下説明では $Cuo\{220\}//ND-Fiber$ として扱います。

無配向 $Cu材料\theta/\theta$ プロファイル



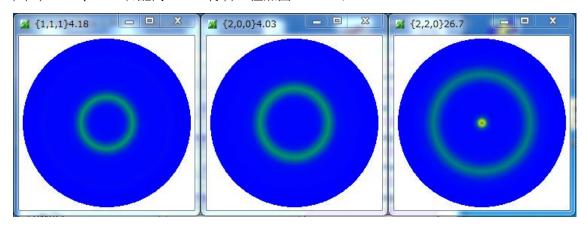
{220} 88%配向のCu材料プロファイル

無配向材料から $\{220\}$ //NDに80%配向した θ / θ プロファイル(青)



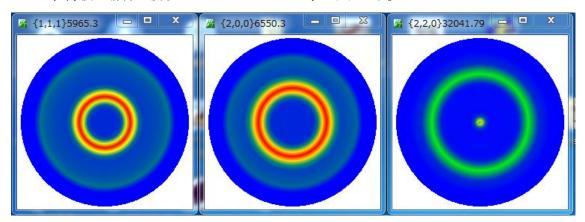
このように、ICDD強度比と異なった場合、配向があります。

{220} //ND、88%配向のCu材料の極点図のシュミレーション



実際に測定される極点図予測

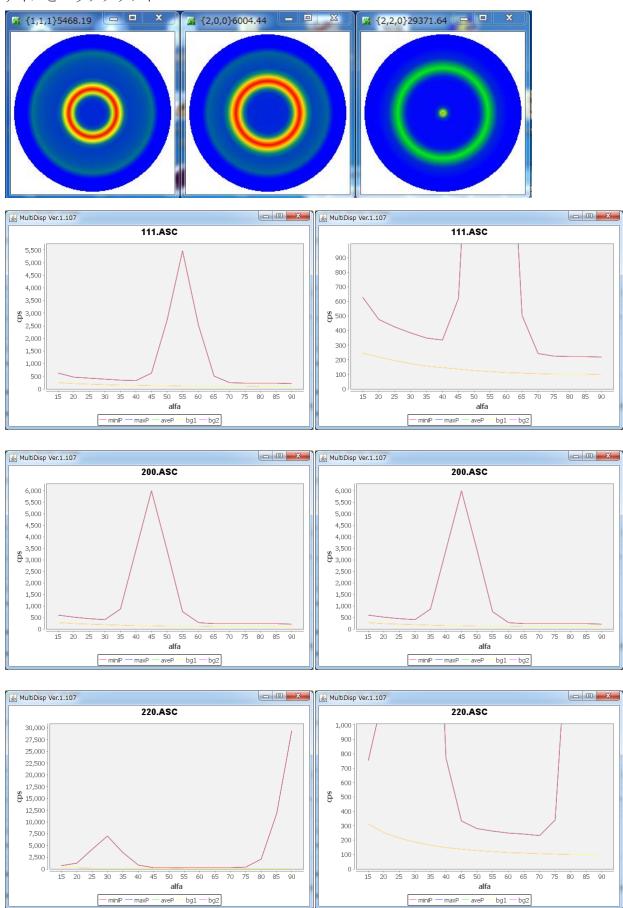
XRDで測定される極点図では、バックグランド、吸収、 defocusの影響を受けます。 しかし、薄膜の場合 吸収 > defocus と考えられます。



極点測定では、

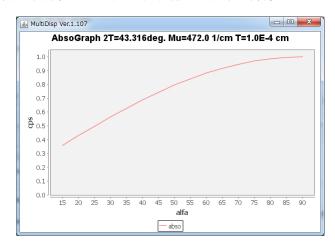
バックグランドを正確に測定 試料の吸収係数を正確に測定 が重要です。

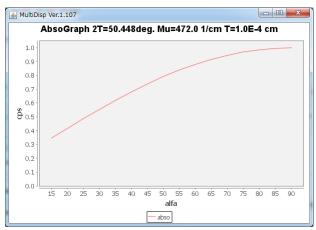
αプロファイルとバックグランド

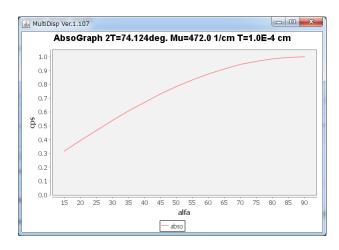


バックグランドが極点図の外周付近で盛り上がっているのは吸収の影響と考えられます。 薄膜の場合、試料を傾けて測定するので、極点図の周辺では反射に寄与する体積が中心付近より 増えている為と考えられます。

薄膜材料の場合、BG削除と吸収補正を行う(最初はdefocus 補正を行わない)。各反射の吸収補正量

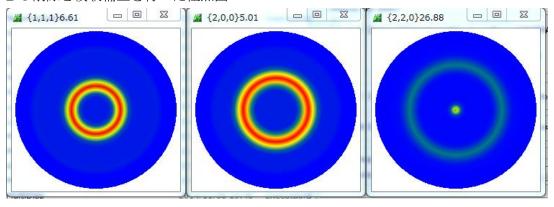




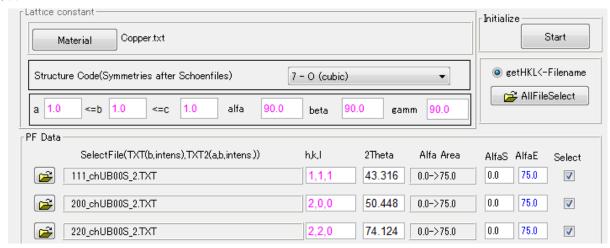


吸収補正は吸収係数と試料の厚さ、測定 2θ 、 α 角度から計算されます。 薄膜材料の defocus は吸収と区別が付き難い。

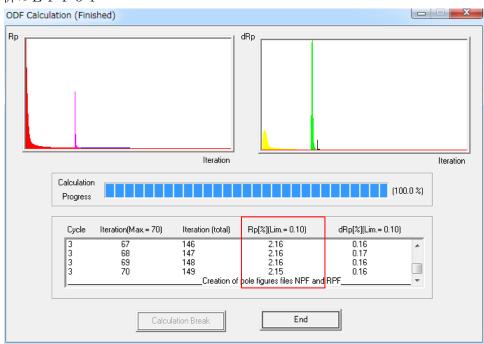
BG削除と吸収補正を行った極点図



ODF解析入力データ



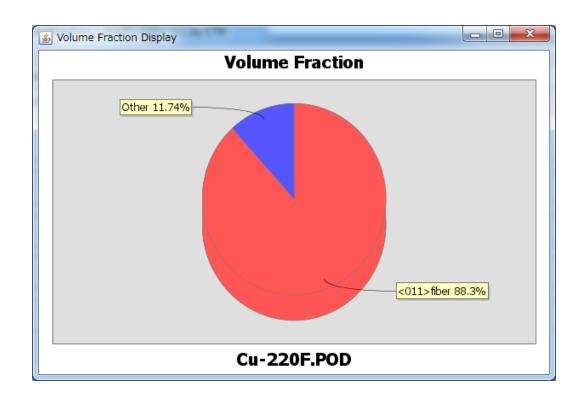
ODF解析のError



Rp%は入力極点図の信頼性である。

極点図をExportして、吸収や、defocusに問題がないかチェックする。

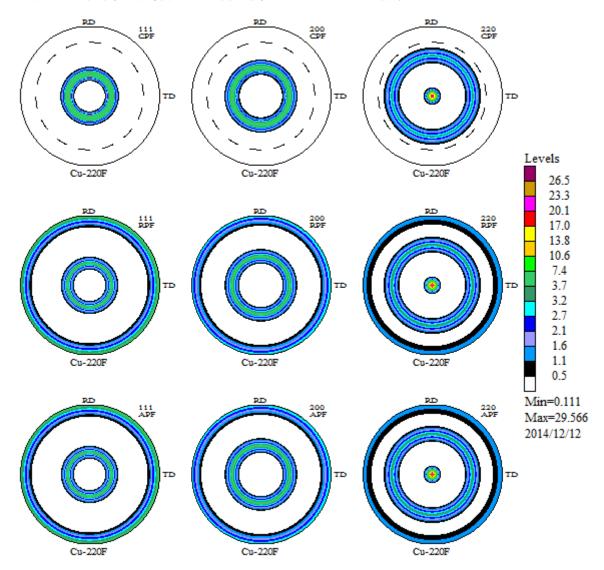




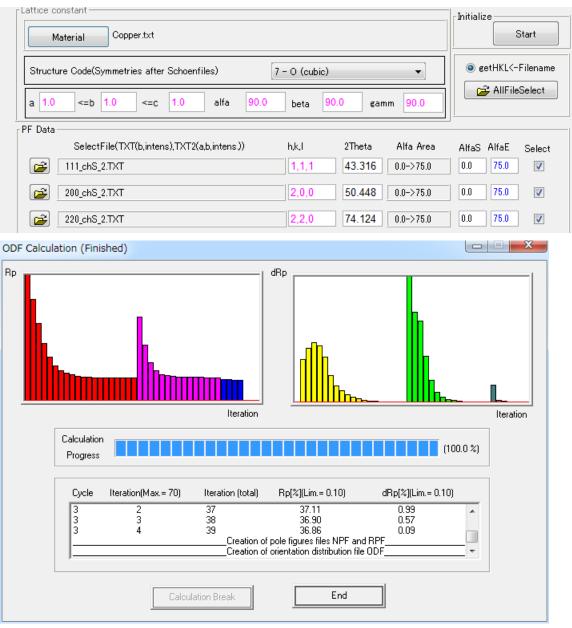
左:入力極点図のODF解析

右: VolumeFraction 結果の ODF 図 Cu-220F Levels 28.5 26.6 24.8 19.1 17.2 13.4 11.5 Max=30.437 Min=0.079 2014/12/12 Cu-220F Levels 28.5 26.6 24.8 19.1 17.2 13.4 11.5 Max=29.699 Min=0.117 2014/12/12 ¢₂•0-90 Δ=5.00 ¢₂=0-90 Δ=5.00

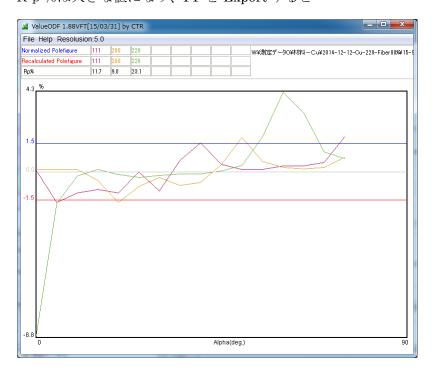
入力極点図(上)、再計算極点図(中央)、VolumeFraction 結果(下)



BG削除、吸収補正を行わない場合

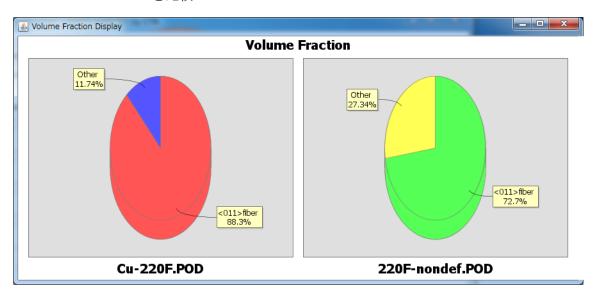


Rp%は大きな値になり、PFを Export すると



右肩上がりで 吸収補正されていない事が 原因である。

VolumeFractionを比較



220//ND-Fiber定量値が下がります。